ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЗИТРОННОЙ АННИГИЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЯВЛЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ

В.И.Графутин, Е.П.Прокопьев, Ю.В.Фунтиков, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева ФГУП ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И.Алиханова, ул. Б.Черемушкинская,25, 117218, Москва, Россия e-mail: epprokopiev@mail.ru

Как утверждается в [1-3], к нефтегазовым нанотехнологиям относятся технологии управления теми наноявлениями, которые определяют извлечение углеводородов из недр. Это прежде всего физико-химические наноявления в геологических средах (телах), пластовых флюидах и промысловом оборудовании при разработке и эксплуатации нефтегазовых залежей. Известно, что эффективность нефтеизвлечения характеризуется коэффициентом извлечения нефти (КИН) от находящейся в пласте ее количества (запасов) [1,2]. При современных технологиях методов закачки воды в пласт для вытеснения нефти (А.П.Крылов и др.) КИН для ряда месторождений достигает величин 0,4-0,5. В настоящее время структура запасов нефти 65 % оставшихся значительно ухудшилась (около запасов являются трудноизвлекаемыми). В России значения КИН в них при заводнении составляют 0,1-0.3.

В то же время развитые с использованием современных технологий и нанотехнологий для трудноизвлекаемых запасов КИН нефти достигли значений 0,4. Исследования динамики изменений значений КИН показали, что для микроструктуры нефтегазовых месторождений (пород) важными показателями являются общая пористость и проницаемость. Прямой связи общей пористости с проницаемостью нет, но существует корреляционная связь между пористостью и проницаемостью. С повышением общей пористости повышается проницаемость породы, за счет увеличения эффективной пористости и увеличения количества крупных пор. Это приводит к резкому увеличению величин КИН при закачке воды и других специальных растворов для вытеснения нефти из пластов пород. Особая роль развития нанотехнологий становится необходимой при освоения нанорезервуаров — например, нефтяных пластов баженовской свиты Сибири и газовых пластов с наноразмерными поровыми каналами. Говорится [1], что в баженовской свите (основной кладовой

российских углеводородов) средний радиус пор равен 1-10 нм, что всего в несколько раз больше размеров молекул.

Таким образом, структура порового пространства нефтегазоносных пород определяется в первую очередь его геометрическими характеристиками, такими как размеры нанопор и нанокапилляров и распределениями площадей и объемов пор по их по радиусам. Одним из методов определения параметров порового пространства горных пород, особенно для размеров в нанометровом диапазоне, может служить метод позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС).

Позитроника, включающая также в свой состав и позитронную аннигиляционную спектроскопию (ПАС) (см., например, [4]), позволяет определять как электронную структуру совершенных кристаллов, так и различные несовершенства особо малых размеров в твердых телах и пористых системах, таких как вакансии, вакансионные кластеры и свободные объемы до одного кубического нанометра (нанообъекты пустоты). Она включает в себя в основном три метода: изучение временного распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ), углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ) и доплеровского уширения аннигиляционной линии с энергией 0,511 МэВ (ДУАЛ) [4].

Ниже рассматриваются методы определения размеров нанообъектов, их концентраций и химического состава среды, окружающей нанообъекты, по экспериментально измеряемым параметрам спектров ВРАФ и УРАФ для позитронов, аннигилирующих в пористых системах и дефектных твердых телах на примере пористого кремния и пластин кремния, облученных протонами, на основе теоретических представлений, развитых в [4].

Показано, что одним из эффективных методов определения размеров нанообъектов (вакансий, вакансионных кластеров), свободных объемов пор, полостей, пустот, цилиндрических каналов и капилляров, их концентраций и химического состава в месте аннигиляции в в горных породах (пористых системах, некоторых дефектных породах и особенно в породах с нанопорами) является метод позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС). В качестве примера дан краткий обзор экспериментальных исследований нанодефектов в кварце, порошках кварца, пористом кремнии, кремнии, облученных протонами [4].

Известно [5-7], что позитроны эффективно зондируют свободные объемы нанообъектов (в основном вакансии, дивакансии и поры) с размерами ≤1-100 нм как в металлах и сплавах, так и в полупроводниках и пористых системах. Нами получены на

основе модели движения частицы в плоскости, ограниченной круглой цилиндрической абсолютно непроницаемой стенкой [8-10], более правильные формулы для определения радиусов R_c цилиндрических (символ c) и уточненные формулы радиусов сферических (символ sp) нанопор по ширинам компонент углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ) $\theta_{1/2}$ и энергиям E_{1c} и E_{sp} основного состояния парапозитрония, аннигилирующего в порах в пористом кремнии и диоксиде алюминия

$$R_{c}[\stackrel{0}{A}] = \frac{21,1}{\theta_{1/2}[mrad]}, R_{c}[\stackrel{0}{A}] = \left(\frac{30,58}{E_{1c}(eV)}\right)^{1/2}, \tag{1}$$

$$R_{sp}[\stackrel{0}{A}] = \frac{16.6}{(\theta_{1/2})[mrad]}, R_{sp}[\stackrel{0}{A}] = \left(\frac{18.85}{E_{1sp}(eV)}\right)^{1/2}$$
(2)

где R и $\theta_{1/2}$ выражаются в Å и *mrad* соответственно.

Для экспериментального значения в пористом кремнии $\theta_{1/2} = 0.8$ мрад [9], получили среднее значение радиуса цилиндрических пор $R \approx 26.4$ Å ≈ 3 нм. Их концентрация в пористом слое оказалась равной $\sim 5.6 \cdot 10^{13} \, \mathrm{cm}^{-3}$.

Рассмотрение кинетической схемы аннигиляционных распадов и превращений позитронных и позитрониевых состояний в пористом слое позволяет получить связь между их скоростью захвата k_{tr} порами и интенсивностями компонент I_{g2} [5]

$$k_{tr} \cong I_{g2} \lambda_{cr}, c^{-1} \tag{3}$$

Здесь $\lambda_{cr} \approx \lambda_s = 0.8 \cdot 10^{10}$ с⁻¹ - скорость аннигиляции парапозитрония (p-Ps), интенсивность $I_{g2} \approx 0.015$ (см. табл.1) в [5]). Таким образом по формуле (3) получаем среднюю скорость завата p-Ps порами $k_{tr} = 1.2 \cdot 10^8$ с⁻¹. С другой стороны скорость захвата k_{tr} p-Ps может быть вычислена исходя из известного выражения

$$k_{tr} = \sigma_{tr} \upsilon N_{tr} , c^{-1}$$
 (4)

Здесь σ_{tr} - сечение захвата порами (дефектами) позитрония и позитрона; v - скорость теплового позитрония или позитрона; N_{tr} - средняя концентрация пор (дефектов) (в пористой (дефектной) области кристалла. Таким образом, из приведенных выражений возможно определить размеры величины k_{tr}, N_{tr} и R_{tr} если известны такие параметры, как $\lambda_1, \sigma_{tr}(i), v$. Тепловые скорости позитрония, и позитрона при температуре T=293K

были оценены под формуле $\upsilon = \left(8k_0T/\pi m_+^*\right)^{1/2} \approx 7,52\cdot 10^6$ сm/s для позитрония, для позитрона $\upsilon \approx 1,05\cdot 10^7$ сm/s, где k_0 — постоянная Больцмана, $m_+^* \approx 2m_0$ — эффективная масса позитрона, $m_0^* \approx m_0$ — эффективная масса позитрона, $m_0^* = 9,1\cdot 10^{-28}$ г — масса свободного позитрона. Принимали, что сечение захвата позитронов и позитрония порами равняется величине площади геометрического сечения поры (дефекта) $\sigma_{tr} \approx \pi R_{tr}^2 = 1,256\cdot 10^{-13}$ см². С этими значениями параметров $R_{tr} \approx 2\cdot 10^{-7}$ см, k_{tr} и υ по формулам (3) и (4) определили концентрации пор, служащих центрами захвата р — Ps $N_{tr} \approx 1,27\cdot 10^{14}$ см 3 .

Эксперименты показали [5], что основная часть позитронов аннигилирует в пористом кремнии из позитронных состояний непозитрониевого типа в объеме пор. Будем считать, что такого типа позитронные состояния являются позитронами, локализованными в объеме пор таким же образом, как и атомы позитрония. В этом случае формулы (1) и (2) имеют вид

$$R_{c}[\stackrel{0}{A}] = \left(\frac{61,1}{E_{1sp}(eV)}\right)^{1/2},\tag{5}$$

$$R_{sp}[A] = \left(\frac{37.7}{E_{1sp}(eV)}\right)^{1/2},\tag{6}$$

Исследованные методом позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) образцы пористого кремния с размерами $10\times20\times10$ мм³ были вырезаны из целых пластин кремния р — типа с ориентациями <111>. Для исследований были выбраны четыре образца, определяемые нами как 164 (1) (начальный монокристаллический образец), PR86, PR16, PR17 (образцы пористого кремния, полученные методом электрохимической обработки в растворах $HF:C_2H_5OH$ при силе тока J=10 и 20 мА/см²). Параметры исследованных пластин кремния и основных особенностей спектров УРАФ приводены в табл.1-3.

Таблица 1

Характеристики и параметры исследуемых образцов пористого кремния р-типа

1200	ктернетики и параметры неследуемых образдов пористого кремиих р типа
№ п/п	Характеристика образца
164(1)	Si-монокристаллический, зеркальный, р-тип, <111>, КДБ-10, h=340 мкм.
PR86	Si-пористый, <111>, КДБ-0,03, h=360-370 мкм, HF:C ₂ H ₅ OH=2:1, J=20 мА/см ² , Пористость $\sim 45\% \pm 3\%$
PR16	Si, пористый, <111>, КДБ – 0,03, h = 20 мкм, HF:C ₂ H ₅ OH = 1 : 1, J = 10 мА/см ² , T = 2400 0 C
PR17	Si, пористый, $<111>$, КДБ -0.03 , $h=20$ мкм, 10 мин в $PdCl_2$, $HF:C_2H_5OH=1:1$, $J=10$ мA/cм 2 , $T=2400$ 0C

Таблица 2 Параметры исследуемых образцов монокристаллического и пористого кремния и характеристики спектров УРАФ

№ п/п	$I_{g2}=S_{g1}/S_{sum}$	$I_{g1}=S_{g1}/S_{sum}$	$\Gamma_{\rm g1}$, мрад	$I_p=S_p/S_{sum}$	Гр, мрад
164(1)		0.665±0.035		0.335±0.031	
PR86	0.015±0.003	0.493±0.052		0.492±0.044	
PR16		0.483 ± 0.045	9.01 ± 0.09	0.517±0.041	5.60 ± 0.01
PR17		0.511 ± 0.051	8.98 ± 0.09	0.489±0.044	5.57 ± 0.01

Таблица 3 Характеристики спектров УРАФ исследуемых образцов пористого кремния р-типа и параметры цилиндрических пор

	№ образца	$I_p = S_p / S_{sum}$	$k_{tr} \cdot 10^{-9}, c^{-1}$	R_{tr} , Å	$N_{tr} \cdot 10^{-17}$, cm ⁻³
164(1)	0.335±0.031	0.665±0.035			
PR86	0.493±0.052	0.492 ± 0.044	7.21	13	1.31
PR16	0.483 ± 0.045	0.517±0.041	6.76	13	1.23
PR17	0.511 ± 0.051	0.489±0.044	8.00	13	1.55

Примечание к табл. 1-3: h — толщина пластин кремния, <111> - их кристаллографическая ориентация, КДБ — 0,03 — марка пластин кремния, легированных бором с удельным сопротивлением 0,03 ом·см, Ig = S_{gi}/S_{sum} (i=1,2)— интенсивности гауссовых компонент, а $I_P = S_p/S_{sum}$ интенсивность параболической компоненты в спектрах УРАФ (S_{sum} -суммарная площадь экспериментального спектра УРАФ, а S_{gi} и S_p — соответственно площади гауссовых и параболической компонент в этом спектре). Ј — плотность тока. ($\theta_{1/2}$) $_{g2} = 0,8$ мрад, ($\theta_{1/2}$) $_{g1} = 10,9$ мрад, ($\theta_{1/2}$) $_p \approx 7$ мрад - ширины гауссовых (g_i , i = 1,2) и параболической компонент.

Из табл.1-3 видим, что разность между интенсивностями гауссовых компонент I_g (окисленная), то есть окисленными пластинами кремния, и I_g (не окисленная) (начальная не окисленная пластина) в спектрах УРАФ, может быть записана в виде

$$\Delta I_{\rm g} = I_{\rm g}$$
(окисленная) - $I_{\rm g}$ (не окисленная) = $k_{tr} \tau_1$ (7)

Таким образом среднее значение скорости захвата позитронов порами равна

$$k_{r} = \Delta I_{g}/\tau_{1}, \tag{8}$$

Значения k_{tr} , рассчитанные по формулам (7) и (8) приведены в табл.3. Исходя из этих значений k_{tr} по формуле (4) были рассчитаны значения концентраций пор N_{tr} . Их значения также приведены в табл.3.

Из выражений (1), (2) и (5), (6) также видим, что по энергии в месте аннигиляции на внешних валентных электронах E можно также найти радиусы пор, используя только данные УРАФ. Для этого приведем выражение, связывающее энергию аннигилирующей электронно-позитронной пары с полной шириной на полувысоте [1]

$$E = 6.9 \cdot 10^{-2} (\theta_{1/2})_g^2 \tag{9}$$

Здесь E- энергия в эB, а $(\theta_{1/2})_g$ - полная ширина кривой УРАФ на полувысоте в мрад.

Так для образцов кремния измеренная величина $(\theta_{1/2})_g$ составила 11,1 мрад и ей соответствует средняя энергия аннигилирующей электрон-позитронной пары, равная $E=8,5\,$ эВ и обусловленная средней энергией электронов внешней оболочки атома кремния на стенке поры, которую можно принять равной энергии электрона на внешней оболочке изолированного атома кремния. При этом учитывается, что до аннигиляции позитрон и позитроний успевают термализоваться и измеренная энергия определяется, в основном, энергией электрона. Табличное значение энергии для $Si(3\,p^2-^3\,P_0)\,$ электронной внешней оболочки кремния $E(Si)=8,1517\,$ эВ [7]. Как видим, согласие этих величин энергий E и $E(Si)\,$ вполне удовлетворительное. Таким

образом, позитроны аннигилируют в основном на внешних валентных электронах атомов кремния «стенки» поры. Можно полагать, что разность величин $E - E(Si) = 0,35\,$ эВ обусловлена вкладом энергии связи позитрона, находящегося в поре в энергию аннигилирующих электронно-позитронных пар. В этом случае для определения размера цилиндрических пор рационально использовать выражение (9)

$$R_{c} = \left(\frac{61,1}{E - E(Si)}\right)^{1/2},\tag{10}$$

Таким образом, при значении E = E - E(Si) = 0.35 эВ размер пор равен 13,2 Å.

Далее со значением $R_v \approx 13,2$ Å определили среднее значение сечения захвата позитрона дефектами $\sigma_v \approx 5,5 \cdot 10^{-14}$ см². Для оценок средних значений концентраций пор приняли $k_v \approx 7,9 \cdot 10^8$ с¹, $\sigma_v \approx 5,5 \cdot 10^{-14}$ см² и $v \approx 10^7$ см/с. Получили значение концентрации пор $N_v = k_v / v \cdot \sigma_v \approx 1,4 \cdot 10^{15}$ см³. Зная общую пористость (45%) [6,7] и средний объем поры, можем оценить концентрацию пор из простых геометрических соображений и, сравнив ее с рассчитанной N_v , проверить достоверность принятых приближений. Определенному нами по формуле (2) среднему размеру пор $R_v \approx 3$ нм соответствует их средний объем $V_v = \pi R_v^2 \cdot h \approx 2,8 \cdot 10^{-16}$ см³ Здесь h - толщина слоя пористого кремния. Для случая «плотной упаковки» таких пор их концентрация исходя из величины общей пористости 0,45 могла бы быть равной $N_v^G \sim 0,45/V_v \sim 1,6 \cdot 10^{15}$ см³. Расхождения величины N_v^G с нами определенной концентрацией $N_v = 1,4 \cdot 10^{15}$ см³ не очень велико. Таким образом, изученные методом УРАФ образцы пористого кремния представляют собой микропористые цилиндрические нанообъекты с размерами порядка 3 нм и концентрацией примерно 10^{15} см³.

Согласно этим данным для пористого кремния можно полагать, что эффективными свободными центрами (областями захвата позитронов и позитрония) являются скорее всего сферические и цилиндрические ультрамикропоры и микропоры с размерами порядка 2 нм, находящимися в пористом слое кремния. Зная общую пористость (45%) и средний объем поры, можем оценить концентрацию пор из простых геометрических соображений и, сравнив ее с рассчитанной N_{tr} , проверить достоверность принятых приближений. Определенному нами среднему размеру цилиндрических пор пор $R_{tr} \approx 2$

нм соответствует ее средний объем $V_{tr} = \pi R_{tr}^2 \cdot h = 1,26 \cdot 10^{-16} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Здесь h - толщина слоя пористого кремния. Для случая «плотной упаковки» таких пор их концентрация исходя из величины общей пористости 0,45 могла бы быть равной $N_{tr}^G \sim 0,45/V_{tr} = 3,6 \cdot 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Расхождения величины N_{tr}^G с нами определенными концентрациями $N_{tr} = 3,21 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$ [8] не очень велики, что говорит о правильности предложенной модели. Таким образом, изученные методом позитронной аннигиляционной спектроскопии характеристики образца пористого кремния говорят о том, что здесь имеют место микропористые цилиндрические объекты с размерами порядка 2 нм и концентрацией порядка $10^{15} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Полученные результаты позволяют надеяться, что дальнейшие исследования дадут возможность связать параметры аннигиляционных спектров с размерами пор и их топологией.

Список литературы

- А.Я.Хавкин. Наноявления в в нефтегазодобыче. Вестник РАН. 2009. Т.79. №6. С.519-522.
- 2. И.Н.Евдокимов, А.П.Лосев. Нефтегазовые нанотехнологии для разработки и эксплуатации месторождений. Учебное пособие для РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. М.: РГУ, 2007.
- 3. Н.П.Лаверов.Топливно-энергетические ресурсы. Вестник РАН. 2006. Т.76. №5.
- 4. Графутин В.И., Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П., Фунтиков Ю.В. Заводская лаборатория. 2009. Т.75. №6. С.27-36.
- Е.П.Прокопьев, В.И.Графутин, С.П.Тимошенков, Ю.В.Фунтиков, Дефектоскопия. №10 (2008) 55.
- 6. С.А.Гаврилов, В.И.Графутин, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева, Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, Ю.В.Фунтиков, Письма в ЖЭТФ. 81 (2005) 680.
- 7. О.М.Бритков, С.А.Гаврилов, В.И.Графутин, В.В.Калугин, Ал.С.Тимошенков, О.В.Илюхина, Г.Г.Мясищева, Ан.Тимошенков, Е.П.Светлов-Прокопьев, С.П.Тимошенков, Д.К.Григорьев, Ю.В.Фунтиков, Петербургский журнал электроники. № 3 (2007) 15.
- 8. И.Е.Иродов, Сборник задач по атомной физике, Москва: Госатомиздат, 1960.
- 9. З.Флюгге, Задачи по квантовой механике. Т. 1, Москва. Издательство ЛКИ, 2008.

- 10. Джон Бёрд. Инженерная математика, Москва. Изд. Дом «Додэка-XXI», 2008.
- 11. Физические величины: Справочник, Москва. Энергоатомиздат, 1991.